**PASJ2019 THPI004** 

# 超伝導加速器応用のためのメッキによる Nb<sub>3</sub>Sn 成膜 ELECTROPLATING OF Nb<sub>3</sub>Sn FOR SRF APPLICATIONS

井藤隼人 <sup>#, A)</sup>, 早野仁司 <sup>B)</sup>, 文殊四郎秀昭 <sup>B)</sup>, 菊池章弘 <sup>C)</sup> Hayato Ito<sup>#, A)</sup>, Hitoshi Hayano<sup>B)</sup>, Hideaki Monjushiro<sup>B)</sup>, Akihiro Kikuchi<sup>C)</sup> <sup>A)</sup> SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)

<sup>B)</sup> KEK

<sup>C)</sup> NIMS

### Abstract

 $Nb_3Sn$  is one of the powerful candidates for the surface material of SRF cavities since it enables cavity to operate at higher temperature with high quality factor and has the potential to achieve high accelerating gradient. Electroplating method to produce  $Nb_3Sn$  on Nb substrates has been developed and optimized at Fermilab. In this method,  $Nb_3Sn$  is obtained by electroplating Cu intermediate layer and Sn layer on Nb, and then thermal treatment in an inert atmosphere is performed at a maximum temperature of 700°C. In order to confirm the reproducibility and dramatically advance the research on cavity application, KEK started electroplating of Nb<sub>3</sub>Sn with the same method but different plating solution. The Nb<sub>3</sub>Sn electroplating samples were characterized by SEM/EDS analyses. In this paper, the detail of the electroplating method in KEK and the evaluation of the electroplating sample are reported.

### 1. はじめに

超伝導加速空洞の性能は加速勾配  $E_{acc} \geq Q$  値に よって表される。加速勾配は空洞壁面にかかる磁場 の強さに比例し、空洞が原理的に実現可能な最大加 速勾配は過熱臨界磁場  $H_{sh}$  によって制限される。 Nb<sub>3</sub>Sn の場合、 $H_{sh} = 450$  mT であり Nb の  $H_{sh}(= 240$ mT)と比較して約2倍の値であるため、Nb<sub>3</sub>Sn 超伝導 空洞は従来の Nb 製超伝導空洞に比べて、約2倍の 最大加速勾配を実現する可能性を秘めている。また、 転移温度も18.3 K と高いため、Nb 製超伝導空洞の2 K 運転で実現されてきた Q 値を Nb<sub>3</sub>Sn 超伝導空洞な ら 4.2 K での運転で実現できる可能性がある。この ような背景から Nb<sub>3</sub>Sn は超伝導加速空洞の材料とし て Nb にかわる有力な候補となっている。

Nb<sub>3</sub>Sn の超伝導加速空洞への応用に関する系統的 な研究は1980年代から1990年代にかけて Wuppertal 大学によって Sn 熱拡散法を用いて行われた[1]。現 在では FNAL、JLAB、Cornell 大学などをはじめと する世界中の研究機関で Sn 熱拡散法を用いた Nb<sub>3</sub>Sn 空洞の研究が行われ、従来の Nb 製超伝導加速空洞 が 2K で達成していた Q 値 (10<sup>10</sup>オーダー)を 4.2 K において達成している。しかしながら、最大加速勾 配は 22.5 MV/m 止まりであり、理論的に予想される ような高い加速勾配は達成できていない[2]。

Sn 熱拡散法では超伝導加速空洞の内部で Sn を加 熱し蒸気として空洞内部で拡散させる。拡散した Sn は空洞内壁へ付着し、加熱された空洞内壁で Nb と Sn の拡散反応により Nb<sub>3</sub>Sn を形成する。この Nb-Sn 二元系の反応では、Nb<sub>3</sub>Sn は 930℃以上で Sn の 18 ~ 25%の間に形成される。845℃以下では、NbSn<sub>2</sub> や Nb<sub>6</sub>Sn<sub>5</sub> といった非超伝導相の化合物も形成される恐 れがある(Fig. 1 参照)。また、Sn 熱拡散法では超 伝導加速空洞のような複雑な形状の内壁に、均一に Snを拡散させることは難しい。



Figure 1: Phase diagram of Nb-Sn binary system [3].

そこで、本研究では Sn 熱拡散法にかわる新たな Nb<sub>3</sub>Sn 膜形成の方法としてメッキ法を用いた Nb<sub>3</sub>Sn 層の形成を試みた。メッキ法は低コストかつ処理が 簡単であり、さらに超伝導加速空洞の複雑な形状に も均一に処理を行うことができる。加えて、Nb と Sn 層の間に Cu 層をはさむことで、熱処理温度を 700℃まで下げることを可能にし、さらに NbSn<sub>2</sub> や Nb<sub>6</sub>Sn<sub>5</sub> といった非超伝導相の化合物の形成を抑制す ることができる。以上のことからメッキ法を用いる ことで均一な Nb<sub>3</sub>Sn 層を形成できる可能性がある。

# 2. メッキ法による Nb<sub>3</sub>Sn 膜形成

メッキ法による Nb<sub>3</sub>Sn 膜形成の研究は日米科学技 術協力事業の課題のもと FNAL で行われており、 NIMS の協力のもとで行われた T<sub>e</sub>測定や H<sub>e1</sub>測定の

<sup>#</sup> hayatoi@post.kek.jp

結果から高品質な Nb<sub>3</sub>Sn 膜の形成が確認されている [4]。本研究では FNAL での先行研究をもとに KEK でのメッキ環境の構築を行い、NIMS の協力のもと メッキサンプルの熱処理を行った。

Figure 2 に本研究での電気メッキの概要図を示す。 電気メッキではアノード極板の金属原子が電解質水 溶液を介してカソード極板の表面に堆積する。本研 究ではカソード極板となる Nb 板の両側にアノード 極板を配置し Nb 板の両面から電気メッキを行った。



Anode (+) Cathode (-)

Figure 2: Schematic of electroplating in our plating system.

Figure 3 に堆積層の順序とメッキ後の各堆積層表 面の写真を示す。まず、含リン銅板をアノード極板 としてノーシアンストライク銅メッキにより、Nb板 表面に Cu の薄い層(シード Cu 層)を堆積させる。 熱拡散法では Nb<sub>3</sub>Sn を安定的に形成するために熱処 理温度を 930℃以上に上げる必要があったが、メッ キ法では初めに Cu 層をメッキすることで、熱処理 温度を 700℃まで下げることを可能にし、さらに NbSn<sub>2</sub>や Nb<sub>6</sub>Sn<sub>5</sub>といった非超伝導相の化合物の形成 を抑制する。次に、得られた Cu-Nb サンプルに対し て Sn 板をアノード極板として酸性スズメッキを用い て Sn 層を堆積させる。最後に、得られた Sn-Cu-Nb サンプルに対して無酸素銅板をアノード極板として ピロ銅メッキを用いて Cu 層(バリア Cu 層)を堆積 させる。



Figure 3: Schematic which shows the sequence of each electroplating layer in our electroplating method.

均一かつ密着性の良いメッキを行なうといった観 点からアルカリ脱脂、電解脱脂、エッチング、デス マットをメッキの前処理として行った。各前処理と 各メッキ処理に用いた水溶液の詳細を Table 1 に示す。 Table 1: Flow of Electroplating Process and Details of Each Solution

処理工程	処理薬品	処理濃度 [/L]
アルカリ脱脂	エースクリーン801	50 g
↓水洗	-	
電解脱脂	水酸化ナトリウム	50 g
	トップクリーナーE	50 ml
↓ 水洗	_	
エッチング	エッチャントTI	100 ml
↓水洗	_	
デスマット	35%塩酸	100 ml
↓水洗		
ノーシアンストライク銅メッキ	ソフトカッパーM	500 ml
	ソフトカッパー3	20 ml
	ソフトカッパーS	50 g
↓水洗	-	
酸性スズメッキ	硫酸第一錫	30 g
	98%硫酸	185 g
	トップフローナMu	20 ml
	トップフローナR	8 ml
↓水洗	-	
ピロ銅メッキ	ピロ銅コンク液	200 ml

# 3. 実験

### 3.1 電気メッキ

本研究で使用したニラコ製 Nb 板は厚み 1 mm であ り、メッキ面の面積は 4 cm<sup>2</sup> である。メッキは KEK 化学棟のドラフト内で行い、メッキ溶液の温度を一 定に保つために恒温水槽の中でメッキを行った(Fig. 4 参照)。



Figure 4: Picture of our electroplating system.

様々な電流密度と処理時間でメッキを行うことで、 メッキの均一性や密着性を試験するとともに、様々 な厚みの組み合わせのサンプルを製作した(Table 2 参照)。各メッキ層の厚みに関しては FNAL での先 行研究を参考にした[5]。

### **PASJ2019 THPI004**

 Table 2: Each Electroplating Parameter and Aimed

 Thickness of Each Deposited Layer

工程	温度 電流密度	処理時間	厚み
シード Cu	$40^\circ\!C\ 1\sim 2\ A/dm^2$	5~10分	$1\sim 2\;\mu m$
Sn	$20^\circ\!C~2\sim 4~A/dm^2$	7.5~10分	$10\sim 15~\mu m$
バリア Cu	$50^\circ\!C\ 4\sim 6A/dm^2$	12~50分	$5 \sim 15 \ \mu m$

Figure 5 に基板 Nb と各メッキ処理後のサンプル表面の写真を示す。シード Cu 層を 2  $\mu$ m、Sn 層を 10  $\mu$ m、バリア Cu 層を 10  $\mu$ m に狙ってメッキされたものである。厚みを様々に変えても、Fig. 5 のような光沢があり密着性の良いメッキが行えた。



Figure 5: Picture of sample at each electroplating step.

#### 3.2 熱処理

いくつかのメッキサンプルに対して Nb<sub>3</sub>Sn 層形成 のための熱処理を NIMS にて行った。Figure 6 に熱処 理のステップを示す。ステップは3 段階あり、最初 のステップでは Sn の融点よりわずかに低い 214 °C で 72 時間キープすることでメッキ層のストレスを緩 和し、さらに Sn 層と Cu 層間の拡散を開始する。2 番目のステップでは 458°Cで 10 時間キープすること で液体 Sn 相が形成され、かつ Nb と Cu との拡散が 開始する。そして、最後のステップでは 700°Cで 24 時間かけて Nb<sub>3</sub>Sn 層を形成する。上記の熱処理は 10<sup>-3</sup> Pa オーダーの真空中で行った。



Figure 6: Heat treatment profile for formation of Nb<sub>3</sub>Sn layer.

### 4. 結果

#### 4.1 SEM 観察

シード Cu 層を 1  $\mu$ m、Sn 層を 15  $\mu$ m、バリア Cu 層を 5  $\mu$ mに狙ってメッキしたサンプル(サンプル番 号#007\_a) に対して熱処理後に断面の SEM 観察を 行った Fig. 7 参照)。その結果、基板 Nb の上に Nb<sub>3</sub>Sn 層が 9.8±0.8  $\mu$ m の厚みで形成されていること を確認した。サンプルの最外層には熱処理後に余っ た Sn や Cu によってブロンズが形成されている。超 伝導空洞への応用を考えたときに、これらの不純物 は空洞の著しい性能劣化を起こすことは明らかであ る。そのため酸による溶解や機械研磨なのでこれら の不純物を取り除く必要がある。



2019/07/26 13:42 AL D7.8 x1.0k 100 um

Figure 7: SEM analysis for cross-section of #007\_a sample.

#### 4.2 Tc测定結果

#007\_a サンプルに対して熱処理後に細長くカット し中央部と端部それぞれに対し NIMS で直流4端子 法による T<sub>c</sub> 測定を行った(Fig. 8 参照)。中央部と 端部の両方で転移を確認し、中央部の T<sub>c</sub>は 17.4 K、 端部の T<sub>c</sub>は 17.3 K であった。また、転移幅は中央部 が 0.169 K、端部が 0.291 K であることから、中央部 の Nb<sub>3</sub>Sn の方が純度の高いものが形成されていると 考えられる。



Figure 8: T<sub>c</sub> measurement of #007\_a sample. Blue points and red points show the measurement result at the center part and the edge part respectively.

**PASJ2019 THPI004** 

# 5. まとめ

Nb<sub>3</sub>Sn は H<sub>sh</sub> と T<sub>c</sub>の高さから、超伝導加速空洞の これまでにない高加速勾配化、高Q値化を同時に実 現し得る有望な物質である。従来のSn熱拡散法とは 異なり、メッキ法は低コストかつ処理が簡単であり、 さらに超伝導加速空洞の複雑な形状にも均一に処理 を行うことができる。加えて、Nb と Sn 層の間に Cu 層をはさむことで、熱処理温度を下げることができ、 さらに NbSn<sub>2</sub>や Nb<sub>6</sub>Sn<sub>5</sub>といった非超伝導相の化合物 の形成を抑制することができる。これらのことから メッキ法を用いることで均一かつ純度の高い Nb<sub>3</sub>Sn 層を形成できる可能性がある。本文ではメッキ法を 用いて Nb 上に Nb<sub>3</sub>Sn 層を形成する方法を紹介する とともに、 KEK でのメッキの状況と熱処理により 形成した Nb<sub>3</sub>Sn 層の SEM 観察、T<sub>c</sub>測定結果につい て報告した。それぞれのメッキ層で密着性の良い メッキを行うことができ、SEM 観察では Nb<sub>3</sub>Sn 層が 9.8±0.8µmの厚みで形成されていることを確認した。 また、T。測定ではサンプルの中央部で 17.4 K の シャープな転移を確認した。今後は均一かつ質の良 い Nb<sub>3</sub>Sn 層を形成するための各メッキ層の厚みの最 適化を行い、H<sub>cl</sub> 測定、T<sub>c</sub> 測定により Nb<sub>3</sub>Sn 層の評 価を行なっていく予定である。

# 参考文献

- [1] A.-M. Valente-Feliciano, "Superconducting RF materials other than bulk niobium: a review", Superconductor Science and Technology, 29, 113002 (2016).
- [2] S. Posen et al., "Nb3Sn SRF Cavity Development at Fermilab", Proceedings of the 19th International Conference on RF Superconductor, Dresden, Germany, June 30 - July 5, 2009.
- [3] S. Posen, D. L. Hall, "Nb<sub>3</sub>Sn superconducting radiofrequency cavities: fabrication, results, properties, and prospects", Superconductor Science and Technology, 30, 033004 (2017).
- [4] E. Barzi *et al.*, "An Innovative Nb<sub>3</sub>Sn Film Approach and Its Potential for SRF Applications", Proceedings of the 29th Linear Accelerator Conference, Beijing, China, Sept. 16-21, 2018.
- [5] E. Barzi *et al.*, "Synthesis of superconducting Nb<sub>3</sub>Sn coatings on Nb substrates", Superconductor Science and Technology, 29, 015009 (2015).